Search Notes		

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
09/000,366	HOASHI ET AL.	1
Examiner	Art Unit	
Drew E. Becker	1761	

Drew E. Becker

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
Search 476	pitited	4-24-07	DET
476	524		
	•	•	
			777
			,

INI	ERFERENCI	E SEARCI	HED
Class	Subclass	Date	Examiner
		* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			•

SEARCH NO (INCLUDING SEARCH	I STRATEGY	')
	DATE	EXMR
,		
•		
- 41 - PARI A - 40 1.		
		:
	·	
,		
		ļ